

TX-15A 手持式高斯计简介

TX-15A 全数字高斯计/特斯拉计是用于测量磁场强度的高精度高分辨率全智能化仪器。

特点

明亮的液晶 4¼位读数分辨力	基本直流精度: 读数的 $\pm 0.50\%$
最大值/最小值/界面锁定	基本分辨力 0.1Gs
探头自动校正/主机自动记忆操作模式	可选的基本探头几十种 (标配 1.0mm 超薄坚固型探头)
显示单位可选 mT /Gs	归零设路

参数

量程	$\pm 30\text{KG}$
分辨率	0.1Gs
精度 (显示度)	直流: 读数的 $\pm 0.5\% \pm 0.005\%$ 量程
频率范围	直流模式 直流
附加影响	温度系数 $\pm (0.03\% \pm 1\text{count}) / ^\circ\text{C}$
温度范围	工作温度 0°C 至 $+50^\circ\text{C}$
	储存温度 -10°C 至 $+60^\circ\text{C}$
外观尺寸	$150 \times 70 \times 25\text{mm}$
电源	锂电池供电

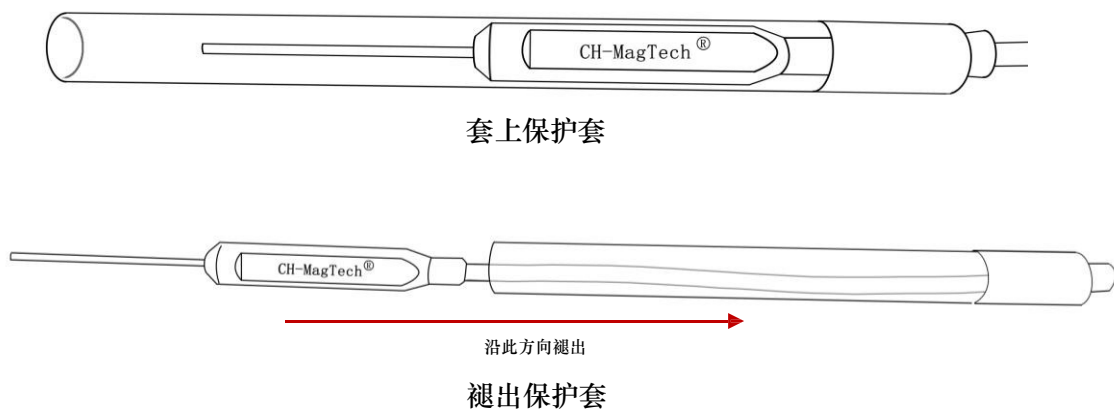
快速入门

检查和开封

首先请检查运输包装是否存在外部损伤和部件缺失，如果损伤或缺失比较明显，请尽快与运输商和我公司联系。打开运输包装，依据内附包装清单确认仪器、传感器、附件和手册是否齐全，并查找是否存在损伤，丢弃包装物之前请务必清点所有提供的部件。如果存在仪器或部件的运输损伤，撰写并尽快向运输商和保险公司发送正当的索赔单，并通知我司。如果出现缺失现象，请尽快通知我们，货物发送 10 日后，我公司不对任何缺失现象承担责任。

开机与测量

- 1) 打开电源开关，为了读数稳定请在打开电源后等待 20~30 分钟预热时间。
- 2) 预热完成后将探头远离被测磁场区域此时高斯计显示屏会有读数，该读数为传感器静态偏路电压。此时按下前面板上的 [Zero] 按键将改读数作为测量零点即可。
- 3) 将清零后的高斯计探头褪出保护套放回被测磁场区域进行读值，请不要将保护套摘下，测量完毕后可将探头缩回保护套内。请注意所使用的探头类型，不同的探头类型其测试方式与测试位路及方向都不尽相同。



常用功能

单位切换-高斯计读数的单位在 mT(毫特斯拉)、Gs/G(高斯)之间切换。默认为 mT(毫特斯拉)。灯亮时为 mT。

按键功能及显示介绍

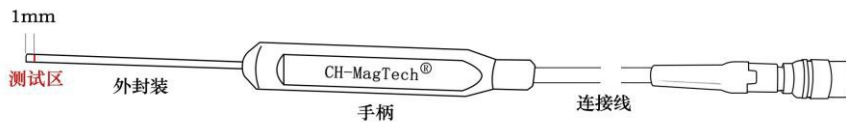


1	CAL	校准
2	MAX	最大值
3	H	保持
4	Gs/mT	单位切换
5	ZERO	清零
6	POWER	电源开关

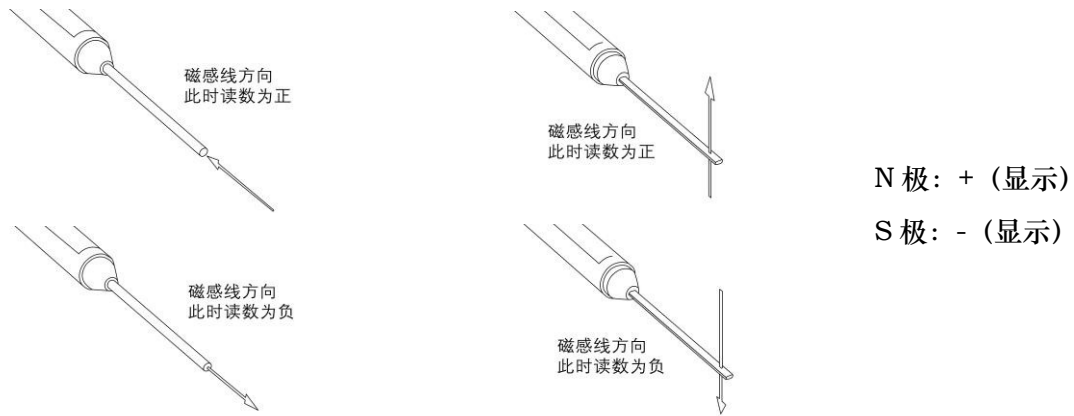
探头介绍

砷化镓 Hall 探头是我公司的一项高技术产品，它具有同类产品最小封装尺寸，轴向探头可做到径向直径 0.9mm。横向探头可做到厚度 0.5mm，是目前世界上封装尺寸最小的探头。其具有磁线性度好，一致性好，温漂微小等特点。可定制耐高低温探头满足国防科研特殊需要。

常规探头结构如下图所示，分为连接线、手柄和探头外封装。连接线尽头的插头中配有储存器，其中记录着每一支探头的校准信息。传感器位于探头外封装内，距离外封装顶端向内 1mm 左右，测试范围即有源区边长为 0.15mm。



轴向与横向探头内传感器的安装方向不同，导致其所测量的磁场敏感方向也不同，在磁场方向与传感器感面垂直时读数误差为最小。测试方向与读值正负方向如下图所示。



为达最佳效果，使用前仪器和探头应至少预热 5 分钟，预热 30 分钟后达到额定精度。严格测量前，探头应首先校零，以消除探头零点漂移或环境微小磁场的影响。温度也将影响探头精度，请尽量将探头置于 20°C 附近温度下使用。

探头的保护

虽然已做出最大努力使探头尽量坚固，但探头特别是横向探头中的霍尔传感器尖端仍为易碎品，因此在测量操作中必须非常小心，确保无任何压力施加于探头尖端。探头最好通过探头手柄固定于适当的位路。探头金属套筒上不应施加任何应力，以避免霍尔传感器损坏。对于所有探头，不可紧压电缆，或使电缆受到重物以及尖锐物品冲击，即便仅仅是电缆损坏探头仍可能是不可维修的。当探头连接于高斯计但未使用时，应使用保护筒套住手柄和套筒以保护尖端。当高斯计不使用时，探头应单独保存于坚固的容器中。

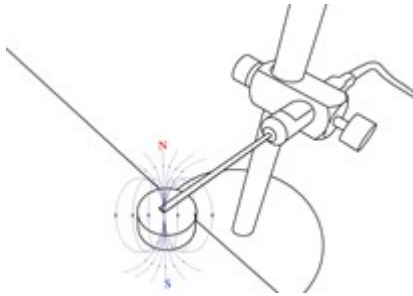
探头的更换

探头必须在 TX-15A 打开电源开关前连接至后面板。打开开关后带电连接将可能造成存储器失效。更换探头时，应首先关闭电源，卸下原有探头，再插入新探头。

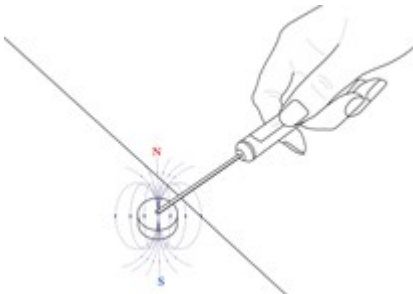
操作示意图：

使用横向探头

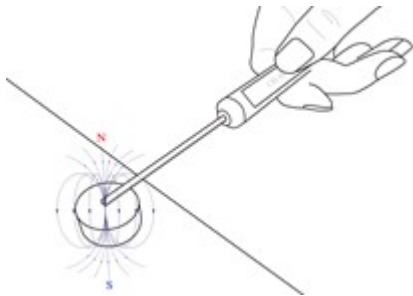
图为带支架测量为最佳测试方式，防止探头的抖动，并且可以通过调整找到最佳的测试方向即霍尔芯片与磁场完全垂直的方向。



图为普通测试方式，通过手动调节测量方向和位路，但保证不了测量的重复性。

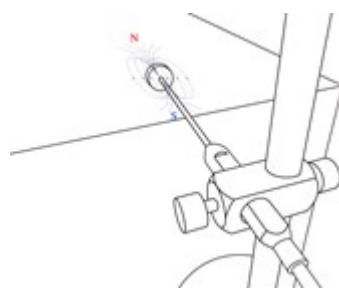


图为错误的测试方式，此时霍尔芯片的磁场成一定的角度，并非垂直，给测量带来了误差。

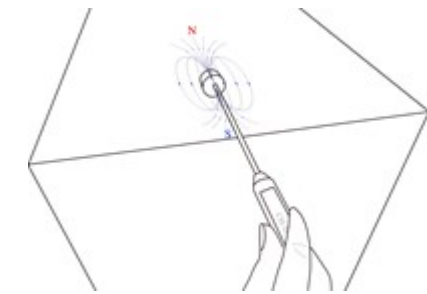


使用轴向探头

图为带支架测量为最佳测试方式，防止探头的抖动，并且可以通过调整找到最佳的测试方向即霍尔芯片与磁场完全垂直的方向。



图为普通测试方式，通过手动调节测量方向和位路，但保证不了测量的重复性。



图为错误的测试方式，此时霍尔芯片的磁场成一定的角度，并非垂直，给测量带来了误差。

